

第1回 AIST(産総研)セミナー2013

「開発手法のイノベーションへの取り組み」

主催：産業技術総合研究所関西センター、組込みシステム産業振興機構

会場：関西経済連合会 29階 294・295会議室

大阪市北区中之島6-2-27(中之島センタービル内)

アクセスは、次のURLを参考願います。

<http://www.rihga.co.jp/nakanoshima/ncb/index.html>

(交流会はリーガロイヤルNCB 3F 桂の間)

「開発手法のイノベーションへの取り組み」

【第1部】

・講演タイトル：

『要件ベースシステム検証技術 -- その必要性と課題について』

・講師：

株式会社デンソー

電子プラネットフォーム開発部 システム基盤開発室

東道 徹也 様

・講演概要

「環境」「安全」の負の影響を最小に抑えつつ、クルマの利便性を最大化するために車載電子システムの役割は益々大きくなってきている。本講演では複雑化が進む車載電子システムの開発における課題を解説し、ブレークスルーと期待される検証技術について、現状と未だ研究レベルで残されている課題を紹介する。

【第2部】

・講演タイトル：

『テスト設計における要求仕様の網羅と合理的なテストケース生成』

・講師：

産業技術総合研究所 セキュアシステム研究部門

北村 崇師

・講演概要

いかに高品質なテストを効率よく行うかは多くのソフトウェア開発に共通する課題である。

本講演では産総研が研究開発中のテスト設計技法を紹介する。本技法はロジックツリーを応用したテスト設計支援技法であり、テスト設計における考慮漏れ曖昧性を低減することでよいテスト設計を支援する。さらに、Pair-wise 法や直交表などの組合せテスト技術を応用し、様々な網羅基準を100%にするテストケースを自動で生成することが可能である。

本技法を自動車の車載システムへ適用した事例についても紹介する。

参加費：講演会参加：無料（非会員 500 円）

交流会：3,000 円／1 人（当日お支払いいただきます。）

（非会員 3,500 円）

→組込みシステム産業振興機構より領収書を発行させていただきます

定員：50 名（先着順）

参加申込み：6 月 19 日（水）までに電子メールにて事務局にお申込みください。

問い合わせ：組込みシステム産業振興機構

事務局 岩井 井原

電話：06-6494-7387

FAX：06-6494-7386

電子メール：esip_info@kansai-kumikomi.net